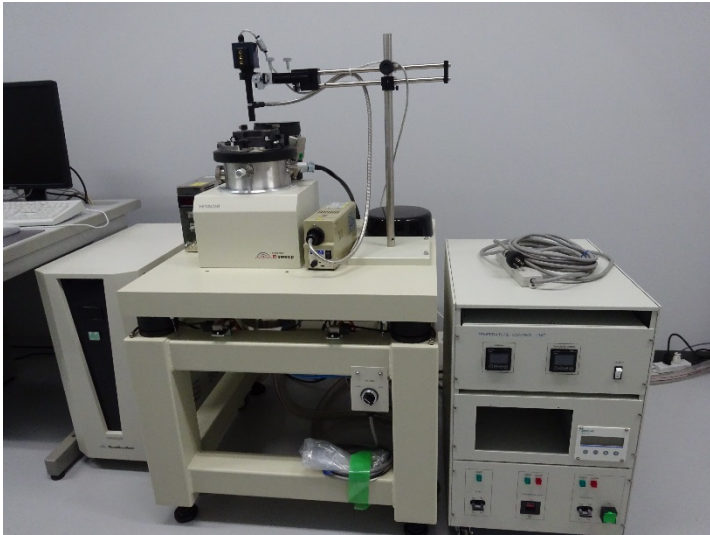


# 走査プローブ顕微鏡システム

(株)日立ハイテク 走査型プローブ顕微鏡 (SPM)  
環境制御型ユニット AFM5300E



従来の大気型走査プローブ顕微鏡（原子間力顕微鏡）ではできなかった試料周辺の環境を制御しながら測定できる環境制御型SPMです。表面吸着水の影響を最小限に抑える高真空状態での形状観察だけでなく、探針と試料の間の相互作用に基づく物性（摩擦力・磁気力・吸着力・表面電位モード・粘弾性）をマッピングすることができます。

## 環境制御

大気中, 液中, 真空中 (到達真空度  $< 9.9 \text{ Pa}$ ), 温度制御 ( $-120 \sim 300 \text{ }^\circ\text{C}$ )

## 測定モード

AFM測定・ダイナミックフォースモード測定 (DFM)・位相差測定モード (フェーズモード)・  
摩擦力顕微鏡機能・磁気力測定 (MFM)ベクタスキャン (加工)・粘弾性測定・吸着力測定・  
表面電位モード

## 最大走査レンジ

面内  $20 \mu\text{m}$ , 垂直  $1.5 \mu\text{m}$  もしくは 面内  $150 \mu\text{m}$ , 垂直  $5 \mu\text{m}$